

1名分料金で
2人目無料

XPS(X線光電子分光法)の基礎と応用

～スペクトル解析・材料評価から装置管理運営まで～

セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/260526>

- ◆日時:2026年05月25日(月) 10:30～16:30
- ◆【アーカイブ配信:5月26日(火)～6月5日(金)(何度でも受講可能)】
- ◆受講料:1名につき55,000円(税込、資料付)

会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で55,000円(税込)から
 ・1名で申込の場合、**49,500円(税込)**へ割引になります。
 ・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計55,000円(2人目無料)**です。

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師:早稲田大学 教育・総合科学学術院 非常勤講師／
 東京理科大学先進工学部 非常勤講師 博士(工学) 中尾 愛子 氏

【受講対象・レベル】

X線光電子分光法(XPS)に携わる経験の浅い方から長年の方、技術改善を目指す方まで、幅広い方々が対象です。

【習得できる知識】

- ・XPSの原理
- ・XPSによる定性、定量、化学状態分析
- ・材料別によるXPSの測定法、試料の調整法
- ・チャージアップ対策
- ・XPSの装置管理体制のヒント

【趣旨】

X線光電子分光法(X-ray Photoelectrons Spectroscopy: XPS)は、材料表面分析手法の一つである。材料表面数nmの定性、定量分析だけでなく、化学結合状態分析が可能で、材料表面の特性を評価するのに有用な手法である。また、検出器と試料の検出角度を変化させる検出角度分解法による非破壊の深さ方向分析や、Ar(アルゴン)スパッタリングを併用しながら、材料の深さ方向の分析も可能である。

本セミナーでは、まず、XPSの原理およびスペクトルから得られる基本的な情報を紹介する。次に、正確な解析を行うための測定条件の最適化、チャージアップ対策、近年注目されているクラスターイオンビームを用いた深さ方向分析、材料により異なる試料調整を紹介し、スペクトルの解析法についても触れる。続いて、実際の測定応用例として、二次電池材料やバイオポリマーなど、機能性材料について実際に評価した事例、また、XPSを最大限にまで活用したチャレンジング解析事例について解説する。最後に、装置のメンテナンスについても触れ、XPS装置の初歩から応用までの全体的な内容を解説す

【プログラム】

1. X線光電子分光法(XPS)

- 1-1. 表面分析とは
- 1-3. 定性、定量、化学状態分析

1-2. XPSの原理

2. XPSの測定手法、条件の最適化

- 2-1. 深さ方向分析
- 2-3. 材料により異なる試料調整法

2-2. 帯電補正

2-4. 測定条件の最適化

3. スペクトルの解析法

- 3-1. スペクトルの構成およびスペクトル処理
- 3-2. ピーク分離の理論と実践

4. 実際の測定例

- 4-1. 機能性材料表面への応用
- 4-2. チャレンジングな解析事例

5. XPS装置の管理・運営

- 5-1. 装置のメンテナンス
- 5-2. メンテナンス体制

『XPS』セミナー申込書<■LIVE ■アーカイブ> ※いずれかにチェックしてください

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>